This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP401106456A

PAT-NO: JP401106456A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01106456 A

TITLE: SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

PUBN-DATE: April 24, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KURODA, HIROSHI TAKASE, YOSHIHISA

ASSIGNEE-INFORMATION:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP62263435

APPL-DATE: October 19, 1987

INT-CL (IPC): H01L023/50; H01L023/28

US-CL-CURRENT: 257/666,257/787

ABSTRACT:

PURPOSE: To make an electrode terminal not to come off due to

external force

and thermal strain by providing the end surface of a lead frame substrate with

a stair part having more than one step and performing molding with sealing

resin in a shape of covering the stair part.

CONSTITUTION: An IC chip 16 is mounted on the other main surface 14 of a die

pad 11, and a pad of the IC chip and the other main surface 14 of an electrode

terminal 12 are bonded with a wire 17 so as to be continuously molded with

sealing resin 18 on the almost level with one main surface 13 by a transfer

method so that the electrode terminal and the main surface 13 of the die pad 11

may be exposed. At this time, a stair part 15 provided on a lead frame 20 is

also covered with sealing resin 18. Thereby, a reinforcing bar 19 exposed to

an end surface of sealing resin 18 is also of the same projection type so as to

have very strong structure against coming-off even to external force.

平1-10 砂公開特許公報(A)

Mint Cl.4

溢别記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(19)

H 01 L 23/50

G-7735-5F A-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1

❷発明の名称

半海体集積回路装置

图 昭62-263435 和特

. 会出 · 関 昭62(1987)10月19日

伊克 明 老 Ħ

啓

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器庭菜

母発 男 去 題

久

大阪府門實市大字門真1006番地 松下電器座菜

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社 砂出 四 人 **舟理士** 中尾 · 飯男 の代 選 人

外1名

1、発明の名称

半導体集表 四點 装置

2、 特許請求の範囲

複数の電極端子を有するリードフレームの一主 面の面紋が、他の主面より終く、とのリードフレ ームの新国形状は少なくとも「駅以上の収益を持 つ政並都を有するものでもり、半等体象数節略は 他の主節にマウントされ、少なくとも電気菓子の 一主都を舞出した形で一主都とほぼ平坦に針止機 財が成形されている半導体集表回路鉄管。

3、気明の評価を説明

世業上の利用分野

本見男は半導体集数距離をパッケージした半導 体集験図鉱盤型に関するものである。

従来の技術

ポータブルな情報ファイルとしてのICカード はカードの一根化メモリ、マイクロプロセッサを 有する半導体集団四路装置を埋込んで、リーダー クイタを介して情報を書き込み、飲み出し、係去 する演算機能を持っているが、180規格 カード厚みは最大 0. 8 4 ミリとされてÞ 5 半導体集款回路装置は更に薄くしかも厚み 強く要求される。

造初半導体集鉄図路装置の芸板はガラス シを当体とする質問当板が主義であったが スエポキシ苗板では10カード用牛等体集! 美俚に要求する解み精度を十分に領足させ てはなかった。

モヒマガラスエポキシ苗板の代文に厚み! よく中級体条数認施装置の背厚の厚み特別 させられるリードフレームを基質とする『 ド用半導件集款回路装置が提案をれた。と(カード用半導体集象図路装置の禁止を第4【 し奴勢する。

複数本の電板建子1とダイパッド2を有* ードフレーム8の上記ダイパッド2に10: ョがマウントされ、上記10テップ3のパ: (国示セナ)と上記電極端子 1 がワイヤ4 * されてかり、少せくとも上記電車電子1の一 5を貫出した形で、しかも上記一主面5とほぼ平 坦に対止御扇6がトランスファ成形法により成形 された 達となっている。

発明が無決しようとする問題点

とのような半導体集務匹勢装置に用いるリードフレーム8の厚味は、半導体集務協助装置に総厚の制限があることからの、1 5 t リ以下が通常用いられる。ところが針止根置のとリードフレーム 8

なる。との状態でカード化しカードの携帯中ある いは使用中に何らかの具物が切断面にできたパリ、 あるいは電極端子自体にひっかかり電極端子をは がしてしまう可能性がある。とのように電極端子 がはがれたり、安形するとICカードとしての機 能が全く失なわれることになる。

本発明は上記問題点を載み、外的な力、能ひす み等に対しても電気増子がはがれて使用不能にな らないようなリードフレームの構造を提供するも のである。

問題点を無決するための手収

そして上記問題点を無決する本発明の技術的手 数は、リードフレームの一主面の面積を他の主面 より終くし断面形状を凸型として一主面と程度平 塩に針止樹脂を広形し、リードフレームの館面を 所定の距離、厚さで程度全辺にわたって針止樹脂 で覆りように検成したものである。

作用

との構成により電極端子のほぼ全辺が対止樹原 でおおわれているととから、電極端子を刺す外部 の他の主面でとの密着性を強化するために、リー ドフレーム8の新缶をサーバ加工し、カナかに針 止制盤のでリードフレームのを覆り形としている が、リードフレームBの厚味が 0.1 B ミリと非常 北部いため、針止樹脂をでリードフレーム8の蜂 面を一部覆り形とした場合でもせいぜい厚味分の O. 15 ミリ租民しか覆うととができず、唯面にテ ーパをつけても針止樹脂6K対するリードフレー ム8の密着強度を書るしく向上させるととはでき なかった。また前にも述べたが対止依疑らには難 影割が入っているため、リードフレーム8との世 潜性が悪く、例えば熱衝撃試験を行った時に発生 する私的ひずみによりリードフレームのが利れる 可能性も生じてくる。更にトランスファ成形袋り ードフレーム8の補強パーを針止複数6の雑節に 拾ってほぼ平坦に全世にて切断して個片の半導件 集教図路装置にするわけであるが、補強パーの切 断面は金型で切断する際、わずかなパリが発生す ることと、完全に針止樹脂6の錐面と平坦にする ことは不可能で、わずかに切断面が突を出る形と

からの力が加わらず、また熱衝撃試験等による熱 ひずみに対しても電極端子が刺れることがないた め信頼性の高い半導体集製回路装置を作ることが 可能となる。

夹苋例

る構造のリードフレームである。とのリードフレーム20の作製方法は一実施例として、まずブレス機でストレートにパンテングした後続いて別の会置を用い同じくブレス機によりリードフレーム2 の結節のみをブレスし所定の量だけ設差部18を作った。他の方法としてエッテングによる方法でも同様の設差部15を作るととは可能である。以上の説明はICテップを塔載するがイパッド11を有するリードフレーム200のリードフレームでもかまわない。

以上述べた取付をリードフレーム20を用いた 半導体象数配数数型の製造プロセスを第3回を~ のに示す。とれは第2回のAーA'の所面を扱わす ものである。ダイペッド110他の主面14に ICチップ16をマウントし、上記ICチップ16 のパッド(図示せず)と上記電を選子120他の 主面14をワイヤ17で接続し(第3回を)、狭 いてトランスファは形法にて上記電板建子12、 及びダイペッド110一主面12を算出させるご

のではなく、パンプを利用したフリップテップポンプィング方式でもかまわない。また同時にリードフレーム20の他の主面質をエッチング、サンドプラストメッキ法等で租面化処理が第 こされていても良い。更にダイパッド 1 1 が無く I C チップ 1 6が電極熔子 1 2 にかかるようなリードフレーム20を用いる場合は I C チップ 1 6 をマウントするダイポンド物質は絶染性であることはいうまでもない。

発明の効果

本発明の半導体集製図路製置はリードフレーム 基板の建菌に1段以上の収差部を設け、収差部を 被う形で対止関係にて成形しているため、外的な 力にも電極性子は剥れにくく、私需挙試験等の私 ひずみに対しても、電極端子ははがれないことか 5、信頼性の高いものを得ることが可能となる。

4、図面の簡単な説明

第1回は本発明の半導体集積回路装置の一実施 例にかける電管電子就の拡大系積図、第2回4. bは本発明に用いたリートフレームの構造を示す

とく、上記一主面13とほぼ早塩に針止樹脂18 て収形する(禁る回り)。この時リードフレーム 20代設けられた設益部156上記針止樹脂1 で覆われる形となる。更に金型を用いて上記針止 樹脂18の雄節に沿って補強パー1 を切断して 個片の半導体集整図新装置とする(第3図c)。 以上のペた半導体集教団路鉄管の電振端子部の拡 大砲を第1回に示す。この第1回によれば電極幅 子12の一主面と針止樹脂18はほぼ平坦に成形 されてショ、対止樹脂18に埋役した電極端子12 の一部は、舞出している一主面より広がっている 構造となっている。とのととは、電極雄子12の 煌固に形成されている収益部15を完全に対止街 置18が置っていることになり、針止複配18の 建節に貫出している補強パー196同様の凸置で あることから外的な力化対しても非常化制れ化弦 い概念となっている。

以上述べてきた実施例の中でICチップ16の パッドと電極端子12の接続にワイヤ11を用い ているが、ワイヤーポンディング法に設定するも

上面図と新面図、第3図 k ~ c は本発明の半導体 集被図路装置の製造フローを示す新面図、第4図 は従来のリードフレームを用いた半導体集務回路 装置の解逸を示す新面図である。

1 2……電極備子、1 3……一主面、1 4…… 位の主面、1 5……数差容、1 6……I C チップ、 1 7……ワイヤ、1 8……針止御盾、1 9……補 致パー、2 0……リードフレーム。

代理人の氏名 弁証士 中 尾 駄 男 ほか1名



